

検査証明書

依頼者	
住所	
品名	
型式	
数量	
製造番号	
製造者	株式会社 渋谷光学
検査項目	寸法
検査方法	精密自動二次元座標測定機にて測定
環境条件	測定時の温度を記載
検査年月日	

検査結果は次頁以降のとおりであることを証明します。

埼玉県和光市下新倉三丁目22番2号
株式会社 渋谷光学
代表取締役社長 下平誠一郎

この証明書は、システムアドバンス株式会社(埼玉県川越市芳野台2-8-28)に検査を委託し、その結果に基づき株式会社渋谷光学が発行し、検査結果を保証するものです。

検査結果

(測定温度:測定時の温度●●℃)

目盛の長さ :
目 量 :使用した常用参照標準器等
(品名)

(製造者名)

(型式又は性能)

(識別番号)

精密自動二次元座標測定機

新東Sプレジジョン株式会社

SMIC-300Ⅲ

090103

SMIC-800ⅢS

040404

備考

特記事項

検査品の受領後、修理及び調整を行わず検査を実施した。

以上



Certificate of Inspection

Applicant: [Redacted]
Address: [Redacted]
Object: [Redacted]
Model: [Redacted]
Quantity: [Redacted]
Serial No.: [Redacted]
Manufacturer: Shibuya Optical Co., Ltd.
Inspection Item: Length
Inspection Method: Measurement by Super Micro Image Processing CMM
Environment Conditions: Room Temperature 23°C ± 1°C
Inspection Date: [Redacted]

This is to certify that the inspection result of the above object are as shown in the following page.

Seichirou Shimodaira
President
Shibuya Optical CO.,LTD
3-22-2 Shimonikura,Wakou-Shi
Saitama,351-0111,Japan

Shibuya Optical Co., Ltd delegates the measurement and inspection to System Advance Co., Ltd. (2-8-28 Yoshinodai, Kawagoe-Shi, Saitama, 350-0833, Japan) This certificate is issued and guaranteed by Shibuya Optical co., Ltd. based on the result of inspection in System Advance Co., Ltd.

Result of Inspection

(Measurement Temperature : 測定時の温度℃)

Scale Length :
Scale Interval :

The reference standard used for the Inspection
(Commodity) (Manufacturer) (Model) (Discrimination Number)
Super Micro Image Processing CMM SINTO-S-PRECISION, LTD. SMIC-300III 090103
SMIC-800III 040404

Remark:

Special Mention : After receipt of the object for inspection, the inspection was performed without adjustment or repair.

End